

分析機器部門講習会シリーズ

マルチ検出モードプレートリーダー デモ

～吸光測定、上下方蛍光測定、時間分解蛍光測定、発光測定、HTRF 測定、Alpha Technology 測定 (AlphaScreen、AlphaLISA、AlphaPlex) 方法のデモンストレーション～



要旨

本装置の吸光測定はモノクロメーター方式であり、各種蛍光測定においては汎用性の高いモノクロメーター方式と高感度なフィルター方式をアッセイによって選択可能です。

発光測定は 38 種類のフィルターを搭載しており、様々なアッセイに対応でき、高精度な結果が得られます。Alpha Technology 測定においては、高出力レーザー光源と、業界唯一の IR センサーによる温度補正機能を搭載することで、高均一性を実現いたします。

セミナーでは測定結果が自動でエクセルにアウトプットされるソフトのご紹介や、解析ソフトのご説明をさせていただきます。また、多検体の核酸を微量で定量可能なユニットをお試しいただくことも可能です。

講演者：石井宏明 (テカンジャパン株式会社 アプリケーションスペシャリスト)
高橋直樹 (テカンジャパン株式会社 セールス)

日 時 : 平成31年3月4日 (月) 14:00～15:20 (セミナー)
平成31年3月4日 (月) 15:30～16:30 (デモ)

受講対象 : ご利用者

講習内容 : マイクロプレートリーダーのデモンストレーション

場 所 : 基礎研究棟4階遺伝情報解析室

定 員 : 10名

申込期間 : 平成30年 2月25日 (月) まで

申込方法 : 電子メールで、subjectを「Tecan」として、「講習会名」、「所属講座」、「氏名」、「内線番号」、「電子メールアドレス」を明記の上、yitoh@med.nagoya-u.ac.jp宛にお申し込みください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当：伊藤 (内線：2403、Email：yitoh@med.nagoya-u.ac.jp)

※Webでも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)